

COMPORTAMENTO DOS INTERSTICIAIS E SEUS AGLOMERADOS EM OURO IRRADIADO COM ELÉTRONS, UTILIZANDO DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DIFUSOS.



Eddy Segura Pino Comissão Nacional de Energia Nuclear - SP Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares



SUMĀRIO

O comportamento dos defeitos induzidos em ouro pela irradiação com elétrons foi analisado utilizando-se difração de raios-X difusos. Monocristais de ouro foram irradiados a uma temperatura de 5K com elétrons de 3MeV. Em amostras irradiadas com pequenas doses e a 5K, não foi observada a presença de interticiais simples, mas apenas <u>pe</u> quenos aglomerados. Em amostras dopadas com 400ppm de cobre, foi determinada a supressão da formação de aglomerados e a presença de intersticiais simples associados a <u>ato</u> mos de cobre.

INTRODUÇÃO

Pesquisas realizadas com difração de rai os-X difusos determinaram a estrutura dos in tersticiais e aformação de aglomerados ao fi nal do estágio I da recuperação térmica em Al e Cu [1], irradiados com elétrons em baixas temperaturas.

Ao contrário de outros metais de estrutu ra cristalina do tipo cúbico de face centrada, as características do estágio I não foram ob servadas em ouro. Este estágio se caracteriza pela migração, termicamente ativada,dos inters ticiais.

No presente trabalho são apresentados os resultados obtidos utilizando difração de rai os-X difusos em ouro e com isto mostrar que os interticiais migram e formam aglomerados duran te a irradiação com elétrons a 5K.

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DIFUSOS SOBRE DEFEITOS PUNTIFORMES

Considerando uma distribuição estatística com baixa concentração de defeitos e uma super posição linear das deformações do campo elásti co ao redor de um defeito, a intensidade da di fração difusa é proporcional a concentracão dos defeitos, c, e ao quadrado de uma amplitude que é dada pela transformada de Fourier do cam po de deformação ao redor do defeito [2]. Fazen do uso da teoria da elasticidade, esta intensi dade, denominada intensidade de Huang,I_H, é da da pela relação:

$$I_{H} = cf^{2} \frac{h^{2}}{q^{2}} \left[\gamma^{(1)} \eta^{(2)} + \gamma^{(2)} \eta^{(2)} + \gamma^{(3)} \eta^{(3)} \right] \frac{1}{\Omega^{2}}$$
(1)

onde y⁽ⁱ⁾ são fatores que dependem das constantes elásticas do cristal, c_{ij} , e das direções de \vec{q} e h, onde h é o vetor réciproco do cristal e \vec{q} é a distância mais próxima entre o vetor de di fração K e o vetor h ($\vec{q} = \vec{K} - \vec{h}$). f e Ω são o fator e volume atômico respectivamente.

Na equação (1), 1⁽¹⁾, são expressões quadrá ticas das componentes do tensor P. que descre ve o campo de deformação ao redor¹¹do defeito:

$$r^{(i)} = \frac{1}{3} (digP)^{2}; r^{(2)} = \frac{1}{6} \sum_{i>j} (P_{ij} - P_{jj})^{2}; r^{(3)} = \frac{2}{3} \sum_{i>j} \frac{P_{ij}^{2}}{i}$$
(2)

onde (dig P) é a soma dos elementos da diagonal da matriz P_{ij}.

Com uma escolha adequada de \vec{q} e \vec{h} pode-se determinar os parâmetros $| \stackrel{(i)}{i} \rangle$ separadamente: assim, das medições em reflexão (h00) e dire ção [100]obtém-se $| \stackrel{(i)}{i} \rangle$, na direção [011] obtémse $| \stackrel{(i)}{i} \rangle$ e numa reflexão (hh0] e direção [110] obtém-se $| \stackrel{(i)}{i} \rangle$.

A variação do parâmetro de rede, a, é d<u>a</u> da pela relação:

$$3\frac{\Delta a}{a} = \frac{c}{\Omega} \frac{\sqrt{3 q^{(1)}}}{(c_{11} + 2c_{12})}$$
(3)

Portanto, os valores de c, (dig P) e $\frac{\Delta V}{\Omega}$ (onde ΔV é a variação do volume), podem ser determinados de uma combinação de medidas de I_H e $\Delta a/a$.

Os pequenos aglomerados podem ser consi derados como defeitos puntiformes mais fortes numa difração, de modo que supondo uma superpo sição linear de defeitos na formação do aglom<u>e</u> rado, tem-se:

$$I_{\rm H}^{\rm aglom} = \frac{c}{N} \cdot N^2 I_{\rm H}^{} = c N I_{\rm H}$$
⁽⁴⁾

onde N é o número de defeitos simples por aglo meradado. Neste caso I^{gglom} aumenta proporcionalmente a N.

Para aglomerados maiores, a relação (1) se aplica com algumas restrições, de modo que para valores de q₂1/R₂ onde R₂ tema magnitude do raio do aglomerado,a intensidade da difração d<u>i</u> fusa é dada pela aproximação de Stokes-Wilson [2].

$$I_{SW} = cf^{2} \frac{h}{a_{\Omega}^{4}} |dig P|_{\delta_{SW}} (\vec{a}, \vec{h})$$
(5)

onde 🔩 representa uma função de ângulo.

Resultados após irradiação a 5k

Na tabela 1., estão resumidas as características das amostras, doses de irradiação e os resultados obtidos a 5K. As doses de irradiacão são dadas pela corrente integrada de elétrons e pela variação da resistividade elétrica. Estas doses, nas amostras puras, são proporcionais a Aa/a. Os valores grandes de

Amostra	Pureza (RRR)	IRRADIAÇÕES			RESULTADOS 5K.		
		Ø. t. 10 ⁻¹⁸ [e ^{-/} cm ²]	Δ]. [n Ω cm]	<u>Δα</u> x 10 ⁶	C [ppm]	<u>AV</u> Л	Ci [ppm]
A	1500	8	102	8±1	11	30	300
B	1500	4,5	53	4	21	7	150
C	2000	2	24,5	2	17	5	80
F ⁺	400ppmCu	1,8	42	4	150	1,1	150

Tabela 1. Resultados dos defeitos após irradiação a 5K

 $\Delta V/\Omega$ confirma a presença de aglomerados, dado que os intersticiais simples tem um valor de $\Delta V/\Omega$ entre l e 2 [1].

Na figura l são mostrados exemplos dos re sultados da intensidade I, em função de q medi dos em monocristais de ouro de $80 \mu m$ de espessu ra, irradiados com elétrons de 3MeV a 5K [3].



Fig. 1. Intensidade de Difração em espaço recíproco. Amostras Α: x; B:o;c: Δ;F*e

As amostras de alta pureza mostram um com portamento semelhante: para grandes valores de q a intensidade é proporcional a q⁻⁴ e_2 para pe quenos valores de q, proporcional a q⁻⁴.

Estes resultados estão em concordância com a difração difusa de aglomerados de defei tos puntiformes [1]. Considerando a variação da resistividade elétrica, Ap, como medida da concentração de defeitos a intensidade I na região q⁻² mostra uma relação não linear.^HIsto evidencia novamente a existência de aglomera dos nas amostras puras. Na fig. l,a amostra do pada com Cu mostra uma intensidade, I_H, muito menor e uma dependênica q⁻² em toda a^H sua ex tensão, evidenciando a presença de interstic<u>i</u> ais simples fixados nos átomos de cobre.

CONCLUSÕES

Durante a irradiação com elétrons de 3MeV a 5K, se oberva, em amostras de ouro, a presença de aglomerados e um processo de fixação de intersticiais simples nos átomos de cobre. Esta situação corresponde ao final do estágio I observado em outros metais de estrutura cúb<u>i</u> ca de face centrada onde se produz o crescime<u>n</u> to de aglomerados e um processo de recombinação dos pares de Frenkel.

O deslocamento dos intersticiais a gram des distâncias e a fixação dos intersticiais nas impurezas de cobre observada a 5K, poderia ser esclarecido como consequência de colisões em cadeia substituídas (Replacement Collison Chains) ou como um processo aleatório de dif<u>u</u> são de intersticiais. Por outro lado, ainda após muitos anos de pesquisa básica sobre defeitos puntiformes induzidos pela irradiação em metais não ficou esclarecido totalmente o comportamento anômalo da recuperação térmica

REFERENCIAS

- [1] Ehrhart, P., Haubold, H.G. and Schilling, W. "Investigations of Point Defects and their Agglomeration in Irradiated Metals by Diffuse X-ray Scattering". Adv. Sol. Stat. Phys. XIV, 87 (1974)
- [2] Dederichs, P.H., "The theory of diffuse X-ray Scattering and its Application to the Study of Point Defects and their Clusters". J.Phys. F. Metal Phys, 3, 471 (1973)
- [3] Segura, E., and Ehrhart, P., "Intersticials and their Agglomerates in Electron Irradated Gold Investigated by D ffuse X-ray Scattering". Rad. Eff. 43. 233 (1979).
- [4] Koehler, J., "Present Knowledge of Point Defects in Pure Metal". <u>J. Nucl. Mat.</u> 169 (1988) 3-4.

SUMMARY

Single crystals of gold have been irradiated at a temperature of 5K with 3 MeV electrons. The behaviour of the induced defects were investigated by measurements of the Huang diffused scattering of X-au. In pure Gold no single intersticials were observed but enly small

intersticials clusters. In samples doped with about 400 ppm Cu, cluster formation was suppressed and single interstitials trapped at copper atoms were observed. With these results it can be explained, in part, the so far not well undestood irradiation and annealing behaviour of Gold.